

# 全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2025]16 号

## 关于召开《300 mm 硅片表面纳米形貌的评价方法》等 10 项半导体材料标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会及工业和信息化部下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2025 年标委会工作安排，现定于 2025 年 7 月 15 日～17 日在浙江省衢州市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事项通知如下：

### 一、会议内容和资料

会议将对《300 mm 硅片表面纳米形貌的评价方法》等 10 项半导体材料标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 7 月 7 日前将标准稿件等发送至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 7 月 11 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

### 二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2025 年 7 月 15 日全天。

2、报到地点：衢州饭店（浙江省衢州市柯城区三衢路 189 号 电话：0570-8081520）。

3、乘车路线：①衢州站：步行 200 米至火车站乘 102 路至安居小区（荷花西路）站，步行 200 米到酒店，乘出租车到酒店大约 3 公里，打车 10 元左右；②衢州机场：步行 100 米至衢州机场站乘 8 路至美景花场站，步行 200 米到酒店，乘出租车到酒店大约 6 公里，打车 20 元左右。

### 三、会务及联系人

本次会议由金瑞泓微电子（衢州）有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

### 四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2025 年 7 月 9 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，7 月 9 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：7 月衢州半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目

二〇二五年六月二十日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

| 序号 | 组别  | 计划文号及编号                         | 项目名称                                             | 牵头单位              | 备注 |
|----|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----|
| 1  | 第一组 | 国标委发（2025）3号<br>20250148-T-469  | 300 mm 硅片表面纳米形貌的评价方法                             | 山东有研艾斯半导体材料有限公司   | 讨论 |
| 2  |     | 国标委发（2025）12号<br>20250813-T-469 | 半导体晶片近边缘几何形态评价 第3部分：扇形区域平整度法 (ESFQR、ESFQD、ESBIR) | 山东有研艾斯半导体材料有限公司   | 讨论 |
| 3  |     | 国标委发（2025）7号<br>20250575-T-469  | 高温扩散用硅舟及硅保温筒                                     | 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司   | 讨论 |
| 4  |     | 国标委发（2025）7号<br>20250577-T-469  | 化学气相沉积用硅喷射管                                      | 杭州盾源聚芯半导体科技有限公司   | 讨论 |
| 5  |     | 工信厅科函（2025）84号<br>2025-0027T-YS | 再生硅片                                             | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 预审 |
| 6  | 第二组 | 国标委发（2024）16号<br>20240136-T-469 | 金刚石单晶抛光片位错密度的测试方法                                | 中国科学院半导体研究所       | 审定 |
| 7  |     | 国标委发（2024）44号<br>20243062-T-469 | 金刚石单晶抛光片                                         | 安徽光智科技有限公司        | 预审 |
| 8  |     | 国标委发（2024）16号<br>20240137-T-469 | 蓝宝石图形化衬底表面图形几何参数的测定方法                            | 广东中图半导体科技股份有限公司   | 审定 |
| 9  |     | 国标委发（2024）16号<br>20240138-T-469 | 氮化铝单晶抛光片                                         | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
| 10 |     | 国标委发（2024）28号<br>20241934-T-469 | 太阳能电池用砷化镓单晶及抛光片                                  | 南京集溢半导体科技有限公司     | 审定 |